医療用 X-band リニアックにおける高分解能エミッタンスモニターの研究

坂本文人^{A)}、土橋克広^{B)}、今井貴之^{A)}、飯島北斗^{A)}、深澤篤^{A)}、 上田徹^{A)}、渡部貴宏^{C)}、上坂充^{A)}

^{A)} 東京大学大学院工学系研究科附属原子力工学研究施設

^{B)}放射線医学総合研究所

^{C)}Brookhaven National Laboratory

概要

東大原施が開発を進める逆コンプトン散乱硬 X 線源に おける、高空間分解能エミッタンスモニターの研究を行っ ている。遷移放射は電子ビームのエネルギーによって決ま る発光角を有することから、ビームウェストにおけるビー ム発散角及びビームサイズを同時に求めることで、エミッ タンスを測定することが期待できる。通常のエミッタンス 測定手法である Q-scan 法との測定比較により、エミッタン ス測定可能性を示していく。

1 はじめに

逆 Compton 散乱により効率良く大量の X線を生成するため には、ビームサイズを小さくすることでルミノシティを最大限稼 ぐことと、電子ビームの特性(エミッタンス)を正確に把握し、レ ーザーとの精度良い正面衝突をさせることが必要不可欠であ る。硬 X 線源の数値計算結果では、エミッタンス 2.5 πmm mrad、血管造影に必要なX線強度10⁸ photons/secを生成する には衝突点においてビームサイズ 100µm という結論を得た [1][2]。 ライナックで通常ビームサイズ測定に用いられている 蛍光体を用いたスクリーンモニターは、蛍光体の厚みによるに じみの効果により、技術的に空間分解能 100 µm を切ることは 難しい[3]。遷移放射(OTR : Optical Transition Radiation)は、 蛍光体に比べ発光量が極端に小さいという弱点はあるも のの、空間分解能が測定する光の波長程度すなわち回折限 界程度であり、100µm 以下を測定可能と十分に期待され る。また、OTR は電子ビームのエネルギーに依存した発 光角度分布を有することから、電子ビームの発散角度を求 めることが出来る。これにより、OTR 特有のエミッタン ス測定が期待できる。OTR モニターと同様に、高空間分 解能が期待できるものとして、Wire Scanner がある。Wire Scanner は空間分解能が wire 径の半分程度となるため、数 μm の報告がなされている。しかし、wire scanner を用いた O-scan 法によるエミッタンス測定には長時間を要し、硬 X 線源システムへの導入は難しい。ここでは、空間分解能の 高さと、測定体系のシンプルさを追求し、OTR モニター の採用を検討しており、Wire Scanner との詳細な性能比較 を行い、空間分解能 10µm の達成を目的とする。第一段階 として、X-band ライナックを想定し、東大原施 S-band18L ライナック(E~20MeV)を用いて、OTR の発光強度 (S/N 比)の確認及び、OTR 計測体系構築のための第一実験と して、ビームサイズ測定及び発光角度分布の測定実験を行 った。これによりエミッタンス計測を行い、OTR モニタ

ーの実現可能性評価を行った。最終的には、現在平行して 製作を進めている Wire Scanner と、OTR との詳細な性能 比較を行うことで、空間分解能 10μm を実証していく予定 である。

2 理論及び測定原理

・遷移放射 (OTR : Optical Transition Radiation)

OTR は誘電率の異なる 2 つの媒質中を荷電粒子が通過す る時に、媒質の境界面上で電磁波を放射する現象[4][5][6]で ある。実験においては金属薄膜を OTR ターゲットとし、真空と の境界面で放射される光を観測することになる。OTR ターゲッ トからの発光は、前方、後方いずれの方向にも発せられる。そ れぞれの発光の強さは式(1),(2)のように表すことができる。

前方放射:
$$\frac{d^2 W}{d\omega d\Omega} = \frac{e^2}{4\pi^2 c} \frac{\beta^2 \sin^2 \theta}{(1-\beta \cos \theta)^2}$$
 (1)

後方放射:
$$\frac{d^2 W}{d\omega d\Omega} = \frac{e^2}{4\pi^2 c} \frac{\beta^2 \sin^2 \theta}{(1-\beta \cos \theta)^2} \left| \frac{\varepsilon^{1/2} - 1}{\varepsilon^{1/2} + 1} \right|^2$$
(2)

ここで、βは光速に対する電子の相対速度、θは電子の進行方向に対する発光角度、εはターゲット物質の誘電率である。 OTR 発光は、エネルギーに依存した特長的な角度分布を持っており、式(1),(2)よりその強度は 1/γ でピークを持つことが分かる(図 1)。また、発光量の積分強度は電子ビームの電荷量の 二乗に比例することが分かる。

OTRターゲットからのOTR 発光をカメラで観測する場合、カメ ラの焦点の位置により二通りの像を観測することが出来る。焦 点をターゲット上に合わせることで、発光位置分布(ビームプロ ファイル)を表す像が得られ、焦点を無限遠にすることで発光 角度分布を表す像(リング)を得ることが出来る。実験において は、ターゲットをビーム軌道に対して 45 度の角度で挿入し、ビ ーム軌道に対して 90 度方向に放射される、後方放射を観測す ることになる(図 2)。



図 1 単一電子による OTR 発光角度分布(E=20MeV)



図 2 ターゲットを 45°の角度で用いた場合の OTR 発光

·発散角計測法

前述の通り、OTR は電子ビームのエネルギーに依存した発 行角度を持っている。実際の電子ビームは図 1 で示したような ゼロエミッタンスではなく、ある発散角を持って OTR ターゲット に入射することになる。今、電子ビームが持つ発散角度が式(3) に示す正規分布に従うと仮定すると、OTR 発光角度分布は式 (1)と式(3)の convolution として表すことが出来る(式(4))。

$$D(s) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\phi_{rms}} \exp\left(\frac{s^2}{2\phi_{rms}^2}\right)$$
(3)

$$\frac{d^2W'}{d\omega d\Omega} = \frac{e^2\beta^2}{4\pi^2 c} \int \frac{(\theta - x')^2}{\{(\theta - x')^2 + \gamma^{-2}\}^2} \exp\left(-\frac{x'^2}{2\phi^2 rms}\right) dx' \qquad (4)$$

図 3 に任意の発散角度 ϕ_{rms} における、OTR 発光角度分布の 数値解析結果を示す。エミッタンスは電子ビームの waist にお いて式(5)のように表すことが出来る[7]。



すなわち、waist におけるビームサイズと、カメラの焦点を無限 遠に合わせた時の発光角度分布を同時に測定し、図3に示す 数値解と照らし合わせビーム発散角を求めることで、エミッタン スを評価することが出来る。ただし、この計測法では電子ビーム のエネルギー(エネルギー広がりを含む)を既知のものとする。

3 エミッタンス計測実験

図4、表1にエミッタンス測定実験体系及び、ライナックのパラメータを示す。



この実験において OTR ターゲットとしては、安価で入手し易 いガラス基盤アルミ蒸着ミラーを採用した。電子ビームはフォト カソード RF 電子銃により生成され、加速管でエネルギー 18MeV まで加速される。加速された電子ビームはビームライン とOTR チェンバーを仕切る厚さ20µmのチタン窓を通過し、ダ ンプされる。OTR チェンバーは空気チェレンコフ光が発光しな い程度の真空とした。また、数値解析モデルにはエネルギー広 がり(ΔE)に関する考慮はなされていないので、この実験では エネルギー広がりが最も小さいと思われる加速位相の元で行っ た。アルミ蒸着ミラーは OTR チェンバー内にビームラインに対 し45度の角度で設置し、90度方向に放射される後方放射を測 定する。測定に用いる CCD カメラは、OTR の発光量が非常に 小さいことを考慮し、Multi channel plate により光電子増倍機能 を有する、高感度 ICCD カメラを使用した。ビームサイズ及び発 光角度分布を測定するために、CCD カメラをリニアステージに 乗せ、カメラの焦点がターゲット表面と無限遠になる点までの移 動を可能な体系とした。Shot by shot のビームふらつきを考える と、1shot での計測が望ましいが、OTR の発光量が非常に小さ く、1shot 撮影では鮮明なプロファイルを取得することは出来な かったため、カメラの露光時間を 3 秒とし、ゲインを最大として 測定を行った。その結果、S/N 比も測定には影響を与えない程 度の像を得ることが確認された。

・QUAD scan 法によるエミッタンス計測

この散乱の効果を踏まえて、OTR spot による QUAD scan 法 によるエミッタンス計測を行った。その結果を図 8 に示す。 Vertical、Horizontal 共に約 100πmm mrad という結果を得た。



図 5Q-scan によるエミッタンス計測

・発散角計測法によるエミッタンス計測

まず、OTR 発光角度分布計測の原理を理解するために、 CCD カメラの焦点を、OTR ターゲットから無限遠まで測定する ためにリニアステージで CCD カメラの位置を変え、発光が OTR spot からリングになるまでの形状変化を観測した。この際の光 学系を図 6 に示す。焦点距離 f の位置では、平行な光が一点 に集光され、入射ソースの大きさ(ビームサイズ)を考慮する必 要がないことが分かる。この実験体系においてはチタン窓によ る前方遷移放射光がアルミミラーに反射し、迷光となって CCD カメラに入射する恐れがあったため、光沢の無い遮光テープを アルミミラー手前に付着させた。図7に、カメラの焦点を OTR タ ーゲットから無限遠にずらしていった際に観測された角度分布 (OTR リングパターン)の様子を示す。



図 6 発光角度分布計測光学系



図 7 OTR リングパターンの形成過程

カメラ位置がレンズの焦点距離fに位置した場合、角度θで 放射される光は放射ソースの大きさ(ビームサイズ)に関係なく x=fθの大きさで結像される。しかし、カメラの位置がfにない場 合、放射ソースの大きさが影響してくるので、リングは滲んでし まう(図 9,(a),(b))。(c)に示した発光分布が、使用したレンズの 焦点距離(130mm)における像であるが、予想された鮮明なリ ングは得られなかった。これは、光学系のミスアライメントによる ものと考えられる。また、OTRの計測において、レンズの色収 差によるにじみを避けるために、バンドパスフィルターを用いた が、線幅(60nm)が広かったため、色収差が押さえきれていなか った為とも考えられる。(c)からリング強度の最大値 I_{max}、最小値 I_{min}より、電子ビームのサイズ及び発散角を求めたところ、σ $ms=1.1[mm] \phi ms=17[mraad]と求まった。これにより規格化エミ$ $ッタンス <math>\epsilon^n ms$ は 170 π mm mradとなった。しかし、OTRリング形 状が大きく乱れていることから、数値解析におけるエラーが大 きく、精密な評価は難しい結果と言える。

4 まとめと今後

この実験において、Screen モニタ及び OTR によるエミ ッタンス計測を行った。その結果を表2にまとめる。

	表	2	エ	Ξ	v	タ	ンス	計	測結果
--	---	---	---	---	---	---	----	---	-----

	$\epsilon^n_{\rm rms}(x)$	$\epsilon^n_{\rm rms}(y)$
Screen(Q-scan)	115	112
OTR(Q-scan)	120	110
OTR(発散角計測)	170 ± 70	160 ± 70

OTR の最大の欠点である発光量の弱さは、ICCD カメラ を採用し、積算することでエミッタンス計測に十分な強度 を得ることが確認された。OTR の発光強度は式(1),(2)から 分かるように、電荷量の自乗に比例するため、X-band ライ ナック 200nC/RFpulse(20pC/bunch, 10⁴bunches/RFpulse)にお いては、1shot による計測が十分に期待できる結果であると 言える。

また、発散角計測法においては、OTR パターン (リング) の形状に大きな乱れが確認され、エミッタンスの詳細な評 価には至らなかった。この原因としては、この実験で採用 したアルミ蒸着ミラーの表面平坦度が極端に悪かったこ とと、光学系のミスアライメント、及び短レンズを用いた ために、収差の影響への対応がなされていなかった等の課 題点が挙げられる。

次回 12 月に予定している実験においては、新チェンバーを製作し、ビームラインに対するミスアライメントを最小にする。また、線幅の更に狭いバンドパスフィルタ(10nm)及び、アクロマティックレンズを採用することで、単色光を測定対象とし、測定光学系自体の空間分解能を10 μm 程度までの向上を目標とする。また、来年2月には X-band ライナックへのインストールを行い、OTR モニタの有用性を明らかにし、8月にはX線生成実験を行う予定である。

参考文献

- [1]M.Uesaka, et al LINAC 2002, TH410, Gyeongjyu Korea, 19-23 August 2002
- [2]K.Dobashi, et al 8th European Particle Accelerator Conference in Paris, France, 3-7 June 2002
- [3] 榎本収志 "電子リニアックでのビームモニター" OHO 1986
- [4]J.D.Jackson, Classical Electrodynamics. John Wiley & Sons, 1975
- [5]V.L.Ginzburg and V.N.Tsytovich, Transition Radiation and Transition Scattering, Adam Hilger, New York, 1990
- [6]R.Hajima, et al Development of an Optical Transition Radiation beam monitors for Free Electron Lasers JAERI-M 92-188 December 1992
- [7]R.B.Fiorito and D.W.Rule "Emittance Measurements of FEL Accelerators Using Optical Transition Radiation Methods"PAC 1991